

# PSS COBT2000 COB 自动测试机 ▶▶▶



## 产品简介

普赛斯 PSS COBT2000 系列自动测试系统，适用于 VCSEL 多模封装光学耦合前后的模块测试需求。设备不仅验证 COB 模块本身的功能和光学部分的可靠性，还用于 VCSEL 光芯片的可靠性验证测试。独有的收光装置可覆盖不同功率的测试对象，亦可保证功率测试重复性，支持 DDMI、Ith、SE 等相关参数测试，设备具备一致性好，高可靠性，高效生产等特点，兼容 PSS 老化板，可一站式完成 SFP、QSFP、QSFP-DD 等封装 COB 老化、测试工序。

## 产品应用

- VCSEL 光芯片的可靠性验证测试

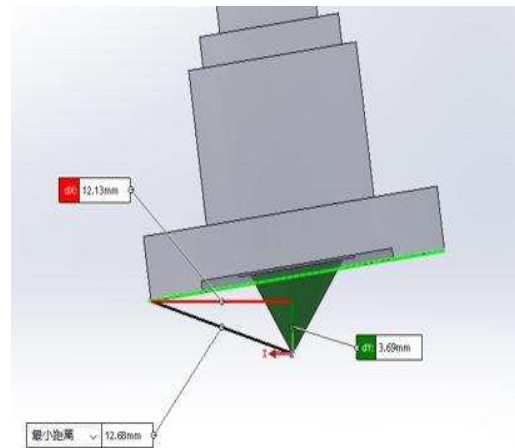
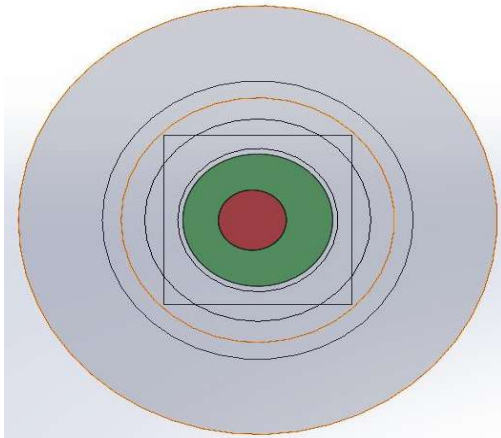


- SFP、QSFP、QSFP-DD 等封装的 COB 老化前后对比测试

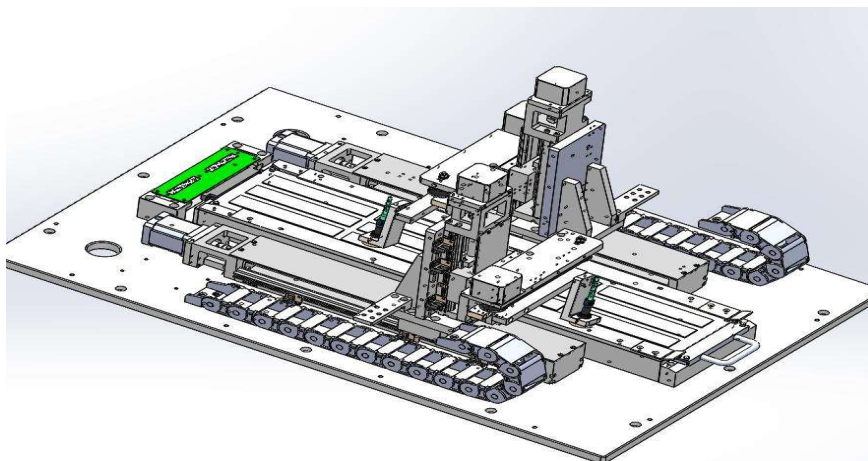


## 产品特点

- 兼容 PSS 模块老化板，可一站式完成 COB 老化、测试
- 模块及协议兼容性强，支持 SFP、QSFP、QSFP28 封装；100G、200G、400G 的测试
- 大面积 PD 收光，收光角度模拟分析，保证功率测试重复性



- 支持双工位 PD 同时测试，提升测试效率



- 支持 Ith、SE 等参数测试，一致性高，重复性高
- 支持 COB 调试，DDMI 信息获取
- 支持老化前后对比，便于分析芯片可靠性
- 支持 COB 固件烧录，方便客户操作

## ■ 技术参数

参数	指标
支持模块类型	SFP、QSFP、QSFP-DD 等封装（可定制）
老化板测试数量（不同功率数量不一致，可定制）	SFP 类型：28PCS QSFP 类型：12PCS QSFPDD 类型：3PCS
多路并行测试	支持并行测试
单板电流驱动能力（功率）	100G SR4 ≤3.5W 200G SR4/SR8 ≤6W 400G SR8 ≤12W
兼容协议	SFF8472、SFF8436、CMIS4.0
功率探测范围	0-10mw, 1%FS±50uW
测试效率（取决于用户 Ith 扫描时间）	1min/COB,12min/Pannel, UPH: > 60PCS (QSFP) 1.5min/COB,4.5min/Pannel, UPH: > 40PCS (QSFP-DD)
测试参数	支持 PI 曲线, Ibisa、Po、Ith、老化前后ΔIth、老化前后ΔPo
VCC 电压	范围：3~3.6V, 精度：0.1%FS±4mV
一致性	Ith<1%、Power<1% (Ith 一致性取决于 COB 的电流精度)
电源	AC200V ~ 240V,50HZ
尺寸 (L*W*H)	820mm*560mm*835mm